

# POLSKA UNIA METROLOGICZNA

## SEMINARIUM METROLOGICZNE

### SEMINARIUM METROLOGICZNE

## Inteligentne rozwiązania metrologiczne dla przemysłu przyszłości x.0

20.03.2024, sala E-3, Targi Kielce,

### Program seminarium

od 9:00	Rejestracja – tryb ciągły
9:30 – 9:40	<b>Jerzy Józwik</b> – Polska Unia Metrologiczna, Politechnika Lubelska Otwarcie seminarium
9:40 – 10:00	<b>Przedstawiciel Kierownictwa GUM</b> – Główny Urząd Miar Działalność Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar ukierunkowana na współpracę z przemysłem
10:00 – 10:20	<b>Magdalena Zawada – Michałowska</b> – Politechnika Lubelska Diagnoza stanu metrologii w Polsce
10:20 – 10:40	<b>Michał Wieczorowski, Bartosz Gapiński</b> – Politechnika Poznańska Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej - Laboratorium Politechniki Poznańskiej
10:40 – 11:00	<b>Adam Brzozowski</b> – Główny Urząd Miar Ciśnienie dynamiczne – nowa dziedzina pomiarowa
11:00 – 11:50	<b>Uchonorowanie 25-lecia firmy ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.</b>
11:50 – 12:10	<b>Wojciech Batko, Andrzej Bąkowski, Leszek Radziszewski</b> – Politechnika Świętokrzyska Analiza niepewności przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku
12:10 – 12:30	<b>Grzegorz Krajewski</b> – Renishaw Sp. z o.o. Inteligentne pomiary międzyoperacyjne. Kontrola przemieszczeń i położenia
12:30 – 12:50	<b>Witold Siemieniako</b> – Hexagon Metrology Sp. z o.o. Kompleksowe podejście Grupy HEXAGON do rozwiązania problemów metrologicznych bezpośrednio na obrabiarkach. Zastosowanie nowej generacji rozwiązań metrologicznych
12:50 – 13:10	<b>Dominik Szała</b> – Carl Zeiss Sp. z o.o. Automatyzacja pomiarów współrzędnościowych w kontroli jakości
13:10 – 13:30	<b>Piotr Ziółkowski, Andrzej Kiercz</b> – Główny Urząd Miar, Targi Kielce SA Klaster Metrologiczny - nowe wyzwania i inicjatywy
13:30 – 13:50	<b>Piotr Orlik</b> – Siemens Inteligentne rozwiązania pomiarowe w sterowaniu SINUMERIK
13:50 – 14:10	<b>Marcin Adamiak</b> – Politechnika Śląska Nowoczesne technologie i metody badań materiałów inżynierskich
14:10 – 14:30	<b>Grzegorz Budzik, Grzegorz Królczyk, Michał Wieczorowski</b> – Politechnika Rzeszowska Metodyka pomiarów geometrycznych obiektów wytwarzanych przyrostowo
14:30 – 14:50	<b>Paweł Chrapowicki</b> – Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska w erze cyfryzacji i sztucznej inteligencji
14:50 – 15:10	<b>Dariusz Brzozowski</b> – ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Skanery laserowe CREAMFORM oraz tomografy komputerowe WAYGATE w aplikacjach przemysłowych
15:10 – 15:30	<b>Anna Gębarska</b> – Smarttech Sp. z o.o. Dlaczego automatyzacja i skanowanie 3D z kolorem są istotne dla przemysłu x.0



POLSKA UNIA  
METROLOGICZNA



Minister  
Nauki



Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego



POLITECHNIKA  
LUBELSKA



Główny  
Urząd  
Miar



Targi Kielce  
exhibition & congress centre